

Venus 5系列

图形化晶圆缺陷量检测设备

Patterned Wafer Inspection & Metrology System



应用范围 Application Scope

晶圆类型

各类图形化晶圆、蓝膜片、扩膜片等2D/3D量检测

晶圆尺寸

兼容4, 6, 8, 12英寸及其它非标尺寸

设备特点及优势 Product Introduction

成像方式

实时自动对焦的
RGB + 暗场四通道

多种通道

明场 (R/G/B) 和全
向暗场多通道同步量
检测

彩色复检

支持同倍率同步彩色
复检图像采集, 兼顾
高检测通量与正检率

灵活分区

支持灵活分区, 及定
义各区检测规则, 适
用复杂需求场景

中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号

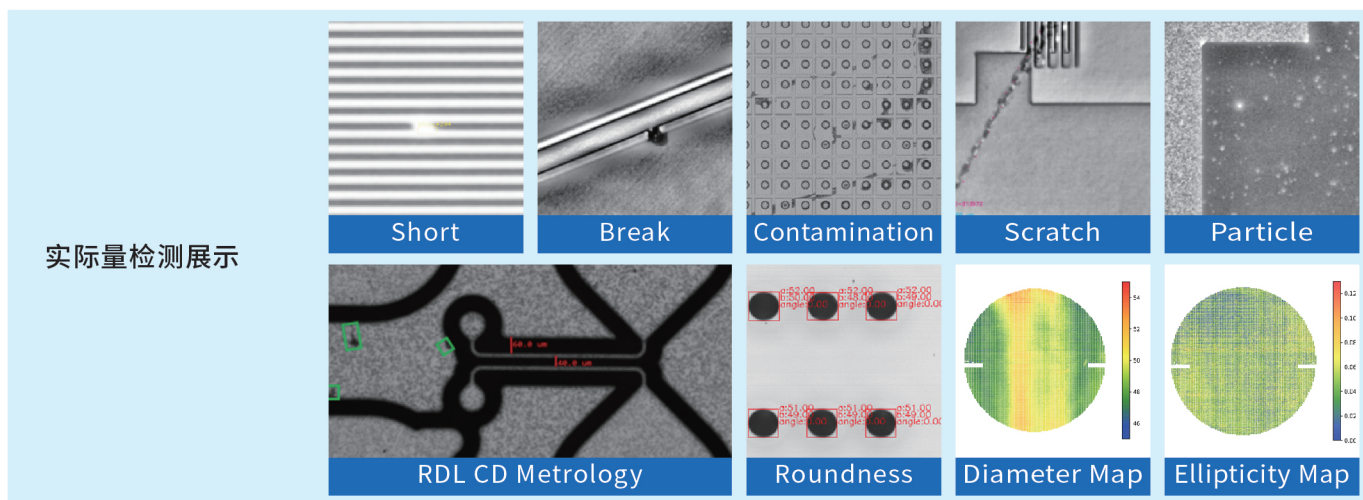
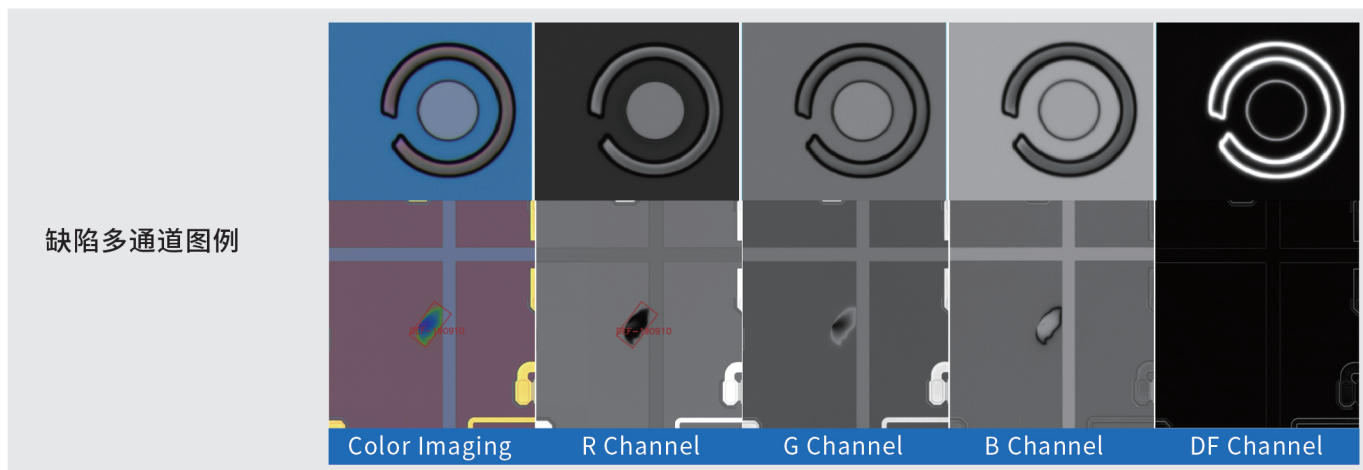
软件算法 Software Algorithm

- ◆ 深度学习结合传统图像的自动缺陷检测算法
- ◆ 支持检测结果关联, 云服务数据追溯与共享
- ◆ 支持灵活分区, 及定义各区检测规则
- ◆ 多通道同位对比、交叉验证和再分析
- ◆ 支持同倍率同步彩色复检图像采集
- ◆ 支持SECS/GEM通信协议, 可与MES系统交互

性能参数 Performance Parameters

技术参数	性能指标
System Size 设备尺寸	2.218 m (L) x 2.466 m (W) x 2.329 m (H)
Inspection Channels 检测通道	明场 (R/G/B) 和全向暗场同时检测
Sensibility 灵敏度	0.126 μm
Repeatability 重复性	$\geq 95\%$

检测图例 Inspected Defects



中电科风华信息装备股份有限公司

网 址: <http://www.zdkfh-ie.com/>

电 话: 18636141900

邮 箱: wangze@zdkfh-ie.com

太原基地: 山西转型综合改革示范区潇河产业园宏业东路11号

上海基地: 上海市闵行区浦江镇江月路999号21号楼



公众号



视频号